PCB와 Chassis 연결에 따른 공통모드 전류와 EMI 감소효과

남기훈*, 심민규*, 고은광*, 나완수* 성균관대*

EMI and Common-mode Current Reduction Effect by PCB-Chassis connection

Ki-Hoon Nam^{*}, Min-Kyu Shim^{*}, Eun-Kwang Ko^{*}, Wansoo Nah^{*} School of Information and Communication Engineering Sungkyunkwan University^{*}

Abstract - 본 논문에서는 인쇄회로기판과 도전체 샤시(Chassis)가 연 결되었을 때의 복사성 방사(Radiated Emission)의 감소에 대해서 연구하 였다. Current Driven 메커니즘 등가회로를 사용하여 전자파 방사의 주 요한 원인중 하나인 Common-mode Current를 인쇄회로기판과 Chassis 가 연결된 구조에 적용하였다. Chassis의 유무에 따라 복사성 방사의 감 소를 확인하고자 2-layer 인쇄회로기판과 SECC(Steel Electro galvanized Cold-rolled Coil) 재질의 Chassis를 나사(Screw)를 통하여 전기적으로 연결하였을 때를 시뮬레이션 하였고, 제작된 구조물을 3m 무반향실에서 복사성 방사를 측정한 후 시뮬레이션과 결과를 비교하였 다. 결과로 30MHz~45MHz에서 최대 10dB 감소의 효과가 있음을 확인 하였다.

1. 서 론

현대 대부분의 전자 제품들 내부의 인쇄회로기판(Printed Circuit Board)은 고속 디지털 IC들과 고속 시그널 trace를 포함하고 있고, 전원 I/O포트 등의 연결로 점점 복잡해지고 있다. 따라서 인쇄회로기판 상의 고속 스위칭 전류나 signal return current path의 불연속성 등으로 인하 여 공통모드 전류(Common-mode Current)가 인쇄회로기판에 발생한 다.^[1] 야기된 Common-mode Current는 인쇄회로기판 상에 전원선이나 신호선과 결합되어 전자파방사를 일으키는 주원인이 된다. 이러한 Common-mode Current로부터 발생된 전자파방사를 감소시키기 위하여 EMI(Electromagnetic Interference) Coupling path에 따른 Termination, screw 위치와 개수, signal return path, 보드와 Chassis 사이의 임피던 스 감소 등에 관한 연구가 계속해서 진행되고 있다.

본 논문에서는 인쇄회로기판의 Ground면과 metal chassis가 screw로 연결되었을 때의 Common-mode currents 변화에 따른 EMI 개선에 대 해 연구하였다. 시뮬레이션 및 측정을 위해 2-Layer PCB와 SECC 재질 의 chassis를 설계 및 제작 하였고, 추가적인 chassis의 유무에 따른 복 사성 방사에 대해서 유한 요소법을 사용하는 HFSS(High Frequency Structure Simulator)와 3m 무방향실에서 복사성 방사 측정을 통해서 저감 효과를 확인하였다. 시뮬레이션과 측정을 서로 비교하였고, 그 결 과 일부 구간에서 metal chassis의 추가로 EMI가 감소함을 확인하였다.

2. 본 론

2.1 이론적 해석

Differential-mode currents(I_{DM})에 의한 방사 필드는 전류의 위상이 서로 180°차이로 인하여 필드가 서로 상쇠 되지만 Commom-mode currents(I_{CM})에 의한 방사 필드는 전류의 위상이 동위상이기 때문에 필 드가 중첩되어 Commom-mode radiation이 발생하게 된다^[2]. 이런 Common-mode currents는 특별히 I/O 인터커넥트 부분에서 주로 복사 성 방사의 원인이 된다. 그림 1은 케이블을 연결하는 인쇄회로기판에서 trace의 등가 회로를 나타낸다. 여기서 V_{DM}은 Signal Source 전압을 나 타내고, Ltrace는 trace의 인덕턴스이며, R은 Termination 저항이다. Ground plane과 trace를 따라 흐르는 Differential mode 전류 I_{dm}에 의해 자속(Magnetic flux)이 발생하고 자속에 의해 인덕턴스 Lplane이 생성된 다. Common-mode Current I_{CM}은 이런 L_{plane}과 커플링 캐패시턴스 C_{art} 에 의해서 야기된 전압강하 V_{CM}으로부터 발생한다[3]. 이를 수식으로 정리하면 식 (3)^[4]과 같다. 따라서 V_{CM}을 야기 시키는 L_{plane}과 Cant가 Common-mode currents에 큰 영향을 미치게 된다.

$$I_{CM} \approx j w C_{ant} V_{CM} \tag{1}$$

$$V_{CM} \approx jw L_{plane} I_{DM}$$
 (2)

$$I_{CM} \approx -w^2 C_{ant} L_{plane} V_{DM} / R \tag{3}$$



<그림 1> Current Driven 메커니즘 등가회로



<그림 2> PCB-Chassis 연결구조

그림 2와 같이 낮은 전달 임피던스를 얻기 위해 보통 인쇄회로기판의 접지면과 Chassis를 연결하게 된다^[5]. 인쇄회로기판의 접지면과 Chassis 가 Screw를 통해 연결된 구조에 위의 해석방법을 적용하면 이 구조는 단락된 전송선로를 추가로 형성하게 되고 이는 인쇄회로기판의 L_{plane}에 Inductor가 추가된 것과 같다^[6]. 간략히 생각해보면 Chassis가 추가됨으 로써 Inductor 2개가 병렬 연결된 것과 유사하므로 V_{CM}이 발생하는 L_{plane} 양쪽 끝에서의 총 Inductance의 감소를 가져와서 식(2)에 의해V_{CM} 이 감소하고, 식(3)에 의해서 Common-mode Current의 감소가 나타난 다. 결국 Ground plane 또는 Cant에 의해 유기된 I_{CM}이 감소함으로 인하 여 안테나처럼 동작하던 케이블에서의 복사성 방사가 줄어들게 된다.

2.2 제작 및 측정구조

인쇄회로기관에 Chassis와 같은 도전체를 추가함으로써 Common-mode Current가 감소하게 되어 복사성 방사가 감소하는 것을 확인하기 위해서 그림 3과 같이 테스트 보드를 설계 및 제작하였다. 제 작된 테스트 보드는 상대 유전율 4.8, 가로 110mm, 세로 210mm의 2-layer이며, Trace 170mm, Width 1.1mm 이고 Trace의 끝단을 비아를 통하여 Ground와 연결하였다.

Chassis는 두께가 1.2mm, 가로 120mm, 세로 220mm 이며 컴퓨터나 TV등의 가전제품에 주로 사용되는 SECC(Steel Electro galvanized Cold-rolled Coil)로 제작하였다. 테스트 보드와 연결하기 위해 보드의 각 모서리 부분에 Screw을 이용하여 연결하였다.

측정 및 시뮬레이션 시에는 Screw로 Chassis를 연결하였을 때와 Chassis를 제거하고 인쇄회로기판만 있을 때의 복사성 방사를 측정 및 시뮬레이션 하였다. 시뮬레이션은 유한요법(FEM : Finite Element Method)을 사용하는 HFSS를 사용하여 모델링 하였고, 방사에 대한 측 정은 3m 무반향실에서 실시하였다.



<그림 3> 제작된 TEST 보드



<그림 4> RE 측정을 위한 구성도

그림 4는 RE 측정을 위한 구성도를 나타낸다. 이 때 보드에서의 신호 를 발생시키기 위해서 트래킹 발생기(tracking generator)를 사용하여 80dBuV의 신호를 인가해 주었고, 바이로그 안테나(BiLog antenna)의 높이가 각각 110cm, 180cm일 때 수평(horizontal) 방향과 수직(vertical) 방향에 대해서 최대값(max)을 측정하였다^[7].

2.3 시뮬레이션 및 측정결과 해석

그림 5는 Chassis 유무에 따른 RE Simulation 결과이고, 그림 6는 Chassis 유무에 따른 RE 측정 결과이다. 그림 5의 시뮬레이션 결과에서 는 Chassis가 보드랑 연결되었을 때 100MHz 부근과 30MHz~60MHz까 지 최대 12dB의 RE 감소 효과가 눈에 보이지만 60MHz~90MHz 사이 에서는 반대로 Chassis를 연결하지 않은 경우가 RE의 감소가 있었고, 100MHz부터는 Chassis 유무에 따른 효과가 미비하였다.

약 40MHz에서 12dB RE의 감소가 Common-mode currents가 원인 인지 확인하기 위해 HFSS의 Field Calculator를 사용하여 보드에 달린 외부 케이블의 중앙위치에서 Common-mode currents를 Chassis 유무에 따라 계산해보았다. 계산치 에서는 Chassis가 인쇄회로기관과 연결되어 있을 때가(3.39A/m) Chassis가 없을 때(8.89A/m) 보다 Common-mode currents가 약 4dB 낮음을 확인하였다.

실제 3m chamber에서 측정한 결과는 그림 6과 같다. 측정에서도 시 뮬레이션과 유사하게 Chassis가 보드랑 연결되었을 때 100MHz 부근과 30MHz~45MHz에서 최대 10dB의 RE의 감소가 있었고, 주파수가 증가 할수록 RE의 차이는 적어졌다.

3.결 론

본 논문에서는 2-layer 인쇄회로기관과 Chassis가 Screw로 연결되었 을 때와 인쇄회로기관만 있을 때의 복사성 방사의 저감효과에 대해 연 구하였다. 시뮬레이션을 위해 Full Wave Simulation인 HFSS를 사용하 였고, 측정을 위해 3m 무반향실의 측정을 통하여 복사성 방사(Radiated Emission)의 결과를 확인하였다. 시뮬레이션을 통하여 인쇄회로기관과 연결된 Chassis에 의해서 Common-mode currents가 저주파 일부 대역 에서 감소되는 것을 확인 하였다. 실제 복사성 방사의 감소가 Chassis에 의한 것인지 확인하기 위해 측정과 시뮬레이션 결과를 확인한 결과 저 주파 일부 대역에서 최대 약 10dB의 감소을 확인하였고 주파수가 높아 질수록 감소 효과는 1dB정도로 미비 하였다.

마지막으로 Chassis를 인쇄회로기판에 연결함으로써 저주파 일부 대 역에서 복사성 방사가 감소하였지만 주파수가 증가함에 RE값의 크기차 이가 적은 이유에 대해서는 추후에 주파수에 따른 임피던스의 변화를 회로모델에 적용하여 Common-mode currents의 변화추이를 분석할 예 정이다.



<그림 5> Chassis 유무에 따른 RE Simulation 결과



<그림 6> Chassis 유무에 따른 RE 측정 결과

[참 고 문 헌]

[1] Naoto Oka, Chiharu Miyazaki, Takeshi Uchida and Shuichi Nitta, "Effect of A Shielding Plane Connected to Ground Plane of A PCB in EM1 Reduction"

[2] JIANQING WANG and OSAMU FUSIWARA, "A simple method for predicting common-mode radiation from a cableattached to a conducting enclosure", "Proceedings of APMC2001"

[3] Motoshi Tanaka, Yoshiki Kayano, and Hiroshi Inoue, "EMI of Printed Circuit Board and Its Modeling", Electronics and Communications in Japan, Part 1, Vol. 89, No. 4, 2006

[4] 심민규, 고은광, 이재열, 홍은주, 박승훈, 곽인구, 나완수, "인쇄회로 기관과 섀시 프레임의 연결에 따른 공통모드 전류변화에 대한 연구", 전 자파기술 하계 학술 대회, Vol-1, 2007

[5] Bruce R. Archambeault, "PCB Design for real-world EMI control", "KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, p65, 2004

[6] Frank B.J. Leferiiik, "INDUCTANCE CALCULATIONS; METHODS AND EQUATIONS", IEEE International Symposium, 1995

[7] Yoshiki Kayano, Motoshi Tanaka and Hiroshi Inoue, "Radiated Emission from a PCB with an Attached Cable Resulting from a Nonzero Ground Plane Impedance", IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EMC, 2005, VOL 3, pages 955-960